

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ОБРАТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Издание официальное

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Метод измерения времени обратного восстановления

ГОСТ
18986.8-73

Semiconductor diodes. Method for measuring reverse recovery time

МКС 31.080.10

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые импульсные и выпрямительные диоды и устанавливает метод измерения времени обратного восстановления.

Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 18986.0.

Требования разд. 4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

I. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Температура окружающей среды при измерении должна быть в пределах $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$.

1.2. Прямой ток, обратное напряжение или обратный ток, при которых измеряют время обратного восстановления диода, должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

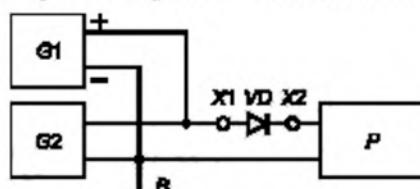
1.3, 1.4. (Исключены, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Принципиальная электрическая схема измерения времени обратного восстановления должна соответствовать указанной на черт. I.

2.2. От генератора $G1$ через измеряемый диод VD и входное сопротивление R_{in} измерительного устройства P подают постоянный или импульсный прямой ток в течение времени, достаточного для установления в измеряемом диоде неравновесных носителей заряда, соответствующего протекающему току.

Затем от генератора $G2$ подают импульс обратного напряжения, запирающий измеряемый диод (при импульсном прямом токе допускается подача постоянного обратного напряжения).



Черт. I

$G1$ — генератор прямого тока с выходным сопротивлением R_{out1} ; $G2$ — генератор импульса обратного напряжения с выходным сопротивлением R_{out2} ; $X1$, $X2$ — выводы; VD — измеряемый диод; P — измерительное устройство с входным сопротивлением R_{in} ; B — точка земли

С. 2 ГОСТ 18986.8—73

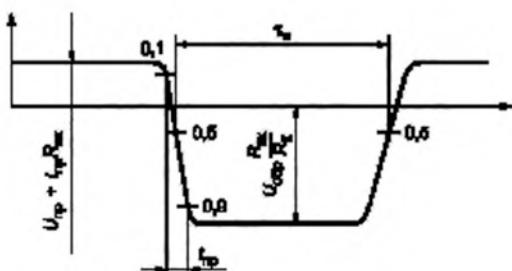
времени от момента прохождения через нуль тока диода до момента, в который уменьшающийся обратный ток диода становится равным заданному отсчетному значению обратного тока $I_{\text{обр. осн}}$.

Эпюра изображения временных параметров импульсов прямого и обратного напряжений, определяемых при короткозамкнутых выводах $X1$ и $X2$ (черт. 1), показана на черт. 2.

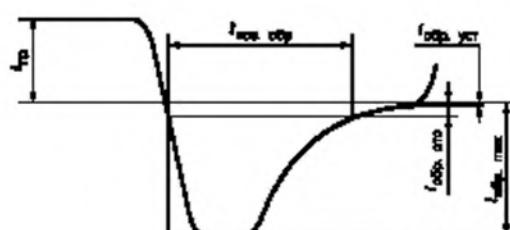
Эпюра тока, протекающего в цепи диода, показана на черт. 3.

Эпюра установления обратного напряжения на диоде между точками $X1$ и землей B (черт. 1) показана на черт. 4.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4

$$(R_{\text{акс}} = R_{\text{ax}}; \\ R_{\text{акс}} + R_{\text{ix}} = R_{\text{L}})$$

2.3. Генератор $G1$ должен обеспечивать подачу через измеряемый диод постоянного или импульсного прямого тока заданного значения, при этом должны выполняться следующие требования:

а) значение прямого тока должно задаваться через диод с погрешностью в пределах $\pm 3\%$ для постоянного прямого тока и в пределах $\pm 10\%$ для импульсного прямого тока;

б) длительность импульса прямого тока должна быть не менее $5 t_{\text{sec}}$ для диода измеряемого типа;

в) неравномерность вершины импульса прямого тока при длительности $5 t_{\text{sec}}$, отсчитанной от момента подачи импульса обратного напряжения, должна быть в пределах $\pm 5\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Генератор $G2$ должен обеспечивать подачу импульса обратного напряжения на измеряемый диод (при импульсном прямом токе допускается подача постоянного обратного напряжения). При этом должны быть выполнены следующие требования:

а) амплитуда обратного напряжения $U_{\text{обр.}}$ или обратный ток $I_{\text{обр. max}}$ должны быть установлены с погрешностью в пределах $\pm 10\%$;

б) выходное сопротивление $R_{\text{акс.2}}$ генератора $G2$ должно быть таким, чтобы суммарное сопротивление ($R_{\text{L}} = R_{\text{ax}} + R_{\text{акс.2}}$) в цепи для тока обратного восстановления измеряемого диода VD соответствовало значению, установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Для диодов с $t_{\text{вн}} < 10$ нс предпочтительно значение суммарного сопротивления — $100 \Omega \pm 20\%$;

в) длительность импульса обратного напряжения $t_{\text{вн}}$ от генератора $G2$ должна быть не менее $5t_{\text{sec}}$ при применении осциллографического устройства. При применении других измерительных устройств длительность $t_{\text{вн}}$ может быть уменьшена, при этом должно выполняться $t_{\text{вн}} \geq 2t_{\text{sec}}$. Частота

импульсов должна соответствовать значению, установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов;

г)неравномерность вершины импульса обратного напряжения при длительности $2t_{\text{rec}}$ должна быть в пределах $\pm 10\%$;

д) время нарастания t_{up} импульса обратного напряжения между уровнями 0,1 и 0,9 его амплитуды, измеряемое при короткозамкнутых выводах $X1$ и $X2$, должно удовлетворять условию $t_{\text{up}} \leq 0,2t_{\text{rec}}$.

Время нарастания t_{up} должно быть определено с погрешностью в пределах $\pm 10\%$;

е) цепи генераторов $G1$ и $G2$ могут быть разделены включением разделительного конденсатора на выходе генератора $G2$. При этом емкость конденсатора C в фарадах должна удовлетворять условию

$$C \geq 20 \frac{i_{\text{up}} \cdot \tau_{\text{up}}}{U_{\text{обр. и}}} .$$

2.5. Устройство P должно обеспечивать измерение временного интервала, соответствующего переходному процессу изменения обратного тока диода от момента прохождения им значения нуля до момента спада обратного тока до заданного отсчетного уровня.

Устройство P может быть как осциллографическим, так и безосциллографическим (например быстродействующий амплитудный дискриминатор), при этом должны быть выполнены следующие требования:

а) время нарастания переходной характеристики измерительного устройства не должно превышать $0,2 t_{\text{rec}}$, которое указывается в стандартах или технических условиях (ТУ) на диоды конкретных типов;

б) для обеспечения согласования и достижения необходимой чувствительности измерительного устройства P рекомендуется иметь входное сопротивление R_{in} измерительного устройства равным 50 Ом (для диодов с $t_{\text{rec, cop}} < 10$ нс). Допускается значение R_{in} в пределах от 0,1 R_z до 1 R_z , где R_z — суммарное общее сопротивление цепи переходного обратного тока измеряемого диода, значение которого устанавливают в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов;

в) допускается шунтирование сопротивления R_{in} диодом в такой полярности, чтобы через него протекал прямой ток измеряемого диода, при этом время обратного восстановления шунтирующего диода должно быть менее одной трети значения t_{rec} измеряемого диода;

г) входная емкость измерительного устройства C_{in} должна удовлетворять условию

$$C_{\text{in}} \leq \frac{i_{\text{rec}}}{5R_{\text{in}}} ;$$

д) калибровка шкалы длительностей устройства P должна быть обеспечена с погрешностью в пределах $\pm 10\%$.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.6. Уровень отсчета тока обратного восстановления i_{rec} и погрешность его определения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Распределенная емкость схемы C в фарадах между выводами $X1$ и $X2$ должна удовлетворять условию

$$C \leq \frac{0,2i_{\text{rec}}}{R_{\text{in}} + R_{\text{вых 2}}} .$$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Индуктивность L в контуре, образованном элементами измеряемого диода R_{in} , $R_{\text{вых 2}}$, должна быть сведена к возможному минимуму, и ее расчетное значение не должно превышать $0,1 (R_{\text{in}} + R_{\text{вых 2}}) t_{\text{rec, cop}}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).